

ТЕОРИЯ КИРАЛЬНОГО ПОЛЯ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ФЛУКТУИРУЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ – МЕМБРАН

В.Л.Голо, Е.И.Кац*

**Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова
119899 Москва, Россия*

*Институт теоретической физики им.Л.Д.Ландау РАН
117334 Москва, Россия*

Поступила в редакцию 12 августа 1993 г.

Релаксационная динамика флуктуаций формы мембраны сформулирована в рамках ланжевеновского уравнения для матричного кирального поля, построенного с помощью локального репера Френе. Концепция кирального поля оказывается плодотворной, позволяя построить формально замкнутую схему вычисления любых корреляционных функций флуктуаций формы для мембраны любой (в том числе и не фиксированной) топологии. Информация о внутренней геометрии поверхности фигурирует в виде явной зависимости корреляционных функций от киральных токов. В качестве иллюстрации метода в общем виде доказана флуктуационно - диссипационная теорема и найдена парная корреляционная функция флуктуаций средней кривизны.

1. Мембраны являются объектами молекулярной толщины, имеющие макроскопическую протяженность, то есть математическим образом мембраны может служить двумерная поверхность, вложенная в трехмерное пространство. Естественно поэтому для описания свойств мембран (и, разумеется, образованных из них разнообразных лиотропных систем [1]) использовать методы классической теории поверхностей.

Основной конструкцией, используемой в теории поверхностей [2], является локальный репер \hat{X} , образованный векторами касательных ($\vec{\tau}_1, \vec{\tau}_2$) и нормали N к поверхности:

$$\hat{X} = \{ \partial \mathbf{r} / \partial \sigma^1, \partial \mathbf{r} / \partial \sigma^2, N \} \quad (1)$$

Здесь \mathbf{r} – радиус-вектор, задающий произвольную точку мембраны, σ^μ ($\mu = 1, 2$) – координаты на поверхности.

Изменение локального репера от точки к точке поверхности описывается уравнениями Гаусса – Вайнгартена [2]:

$$\partial_\mu \hat{X} = \hat{j}_\mu \hat{X}; \quad \mu = 1, 2, \quad \partial_\mu = \partial / \partial \sigma^\mu. \quad (2)$$

Матрицы \hat{j}_μ определяются геометрией поверхности и удовлетворяют условиям интегрируемости:

$$\partial_1 \hat{j}_2 - \partial_2 \hat{j}_1 + [\hat{j}_1, \hat{j}_2] = 0 \quad (3)$$

где $[\cdot, \cdot]$ – коммутатор. Нахождение явного вида матриц \hat{j}_μ представляет собой хотя и громоздкую, но не сложную в принципе процедуру. В общем случае компоненты этих матриц задаются символами Кристоффеля и тензорами первой и второй квадратичной формы поверхности.

Выражения (1) и (2) позволяют определить все свойства поверхности в рамках теории кирального поля, задаваемого матрицами \hat{X} , принадлежащими группе $GL(3, R)$. Например, из (2) следует обычное в теории кирального поля выражение для токов [3]:

$$\hat{j}_\mu = \partial_\mu \hat{X} \hat{X}^{-1}. \quad (4)$$

2. Аналогия с киральным полем оказывается не формальной, а приводит к целому ряду полезных выводов. Детальному обсуждению этого круга вопросов будет посвящена специальная работа. Здесь же мы обратим внимание на некоторые принципиальные моменты.

В теории мембран основную роль играет гамильтониан Хельфрича [4], описывающий зависимость энергии мембраны от ее формы:

$$E_H = \int d^2x \left\{ \frac{1}{2} \kappa (k_h)^2 + \bar{\kappa} k_g \right\}. \quad (5)$$

Здесь κ и $\bar{\kappa}$ – упругие модули мембраны, k_h – средняя кривизна, k_g – гауссова кривизна (для простоты мы рассматриваем бислойные, то есть симметричные, мембраны и поэтому в (5) отсутствует линейный по k_h вклад). Именно возможность записать энергию Хельфрича (5) только через киральные токи \hat{j}_μ и делает концепцию кирального поля весьма полезной для описания мембран. Действительно,

$$k_h = \text{Tr}(\hat{\varphi}^{(2)} \hat{g}^{-1}), \quad k_g = \det(\hat{\varphi}^{(2)} \hat{g}^{-1}),$$

где $\hat{\varphi}^{(2)}$ – вторая квадратичная форма поверхности, \hat{g} – метрический тензор (первая квадратичная форма).

Как известно, интеграл от гауссовской кривизны является топологическим инвариантом и потому, если мы рассматриваем поверхность фиксированной топологии, энергия Хельфрича (5) может быть записана в следующем виде:

$$E_H = \int d^2x a_{ij}^{\mu\nu} j_{ij}^\mu j_{kl}^\nu = \frac{1}{2} \kappa \int d^2x (j_{31}^1 + j_{32}^2)^2. \quad (6)$$

Последнее равенство и является определением матрицы коэффициентов $a_{ij}^{\mu\nu}$.

Равновесная форма поверхности определяется условием минимума функционала (6), имеющим следующий вид:

$$\nabla_\mu (\hat{a}^{\mu\nu} \hat{j}_\nu) = 0 \quad (7)$$

где ∇_μ – ковариантная производная:

$$\nabla_\mu = \partial_\mu + [j_\mu,] \quad (8)$$

3. Для описания флуктуаций мембраны определим согласно с (2) компоненту тока \hat{j}_0 , задающую изменение формы мембраны со временем:

$$\hat{j}_0 = \partial_t \hat{X} \hat{X}^{-1}. \quad (9)$$

Если обозначить матрицей $\delta\hat{v}$ вариацию кирального поля:

$$\hat{X} \rightarrow \hat{X} (1 + \delta\hat{v}),$$

то

$$\hat{j}_\mu \rightarrow \hat{j}_\mu + \nabla_\mu \delta\hat{v} \quad \text{и} \quad \hat{j}_0 = \partial_t \delta\hat{v}. \quad (10)$$

В работе [5] было показано, что для изолированной мембраны, находящейся в равновесии с раствором, существует одна самая мягкая приповерхностная мода, описывающая чистую релаксацию поверхности к равновесной форме. Важным является то обстоятельство, что этот факт остается справедливым

и при учете нелинейных эффектов. Поэтому в главном гидродинамическом приближении все остальные более жесткие моды могут быть исключены, что приводит к некоторому эффективному уравнению ланжевеновской динамики вида

$$\partial_t \delta \hat{v} = \gamma (\delta E_H / \delta v) + y. \quad (11)$$

Здесь γ – эффективный кинетический коэффициент, y – гауссовский случайный шум.

Используя определения киральных токов (4) и явный вид энергии Хельфрича (6) можно преобразовать это уравнение к замкнутому виду, удобному для вычислений:

$$\partial_t \delta \hat{v} = \nabla_\mu (\hat{a}^{\mu\nu} \hat{j}_\mu) + y. \quad (12)$$

В простейшем случае малых флуктуаций $\delta \hat{v}$ линеаризованная правая часть уравнения (12) имеет вид:

$$\gamma \{ \partial_\mu (\hat{a}^{\mu\nu} \nabla_\nu \delta \hat{v}) + [\nabla_\mu \delta \hat{v}, \hat{a}^{\mu\nu} \hat{j}_\nu^{(0)}] + [\hat{j}_\mu^{(0)}, \hat{a}^{\mu\nu} \nabla_\nu \delta \hat{v}] \} + y \quad (13)$$

($\hat{j}_\mu^{(0)}$ – равновесное значение кирального тока, то есть решение уравнения (7)).

Стандартным образом [6] изучение ланжевеновского уравнения (12) или (13), например, нахождение корреляторов флуктуаций $\delta \hat{v}$, может быть сформулировано как вычисление интеграла по путям с эффективным действием:

$$S_{eff} = \int d^2 x dt \{ -p(\partial_t \delta \hat{v} - \hat{M} \delta \hat{v} + (1/2\gamma)p) + \bar{\psi}(\partial_t - \hat{M})\psi \}. \quad (14)$$

Здесь \hat{M} выражается через киральные токи (то есть определяется внутренней геометрией мембраны). Например, для линейного случая

$$\hat{M} = \gamma \{ \partial_\mu (\hat{a}^{\mu\nu} \nabla_\nu \delta \hat{v}) + [\nabla_\mu \delta \hat{v}, \hat{a}^{\mu\nu} \hat{j}_\nu^{(0)}] + [\hat{j}_\mu^{(0)}, \hat{a}^{\mu\nu} \nabla_\nu \delta \hat{v}] \}.$$

В (14) p – вспомогательная бозеевская переменная, а ψ и $\bar{\psi}$ – вспомогательные антикоммутирующие поля.

Непосредственной подстановкой легко убедиться, что действие (14) является суперсимметричным, то есть остается инвариантным при преобразовании:

$$\delta \hat{v} = \gamma (\bar{\epsilon} \psi + \bar{\psi} \epsilon), \quad \delta \psi = \epsilon (\partial_t - \hat{M}) \hat{v}, \quad \delta \bar{\psi} = (\partial_t - \hat{M}) \hat{v} \epsilon,$$

где ϵ , $\bar{\epsilon}$ – два инфинитезимальных антикоммутирующих поля.

Можно также убедиться, что действие (14) приводит к стандартному для релаксационной динамики соотношению:

$$-i \partial_t \langle \delta \hat{v}(0) \delta \hat{v}(t) \rangle = \langle p(0) \delta \hat{v}(t) \rangle - \langle p(t) \delta \hat{v}(0) \rangle, \quad (15)$$

представляющему собой флуктуационно-диссипационную теорему, так как фигурирующие в правой части (15) корреляторы являются ничем иным, как обобщенными восприимчивостями или функциями отклика мембраны на возмущение формы [5].

4. Описанная выше процедура сводит вычисление любых корреляторов, характеризующих свойства мембран, к стандартной задаче теории киральных полей с эффективным действием (14). В самых общих предположениях в рамках предложенного формализма установлена флуктуационно-диссипационная теорема (15) и доказана суперсимметрия эффективного действия.

Важно отметить, что фигурирующие в теории киральные токи сохраняют информацию о геометрии поверхности даже в таких на первый взгляд локальных характеристиках, как корреляционная функция малых флуктуаций $\langle \delta \hat{v}(1) \delta v(2) \rangle$.

Теория кирального поля позволяет также вычислять такие нетривиальные характеристики поверхности, как корреляционные функции средней или гауссовской кривизны. Например, согласно (6) и (10),

$$\begin{aligned} \langle \delta k_h(1) \delta k_h(2) \rangle &= \langle \delta(\hat{j}_{31}^1(1) + \hat{j}_{32}^2(1)) \delta(\hat{j}_{31}^1(2) + \hat{j}_{32}^2(2)) \rangle = \\ &= \langle (\nabla_1 \delta \hat{v}^{31}(1) + \nabla_2 \delta \hat{v}^{32}(1)) (\nabla_1 \delta v^{31}(2) + \nabla_2 \delta v^{32}(2)) \rangle. \end{aligned} \quad (16)$$

В плоском случае фигурирующие в (16) ковариантные производные сводятся к обычным и все вычисления легко могут быть доведены до конца. В фурье-представлении (ω – частота, q – волновой вектор) из (14) находим:

$$\langle \delta k_h(q, \omega) \delta k_h(0, 0) \rangle = \frac{\gamma q}{\omega^2 + \kappa^2 \gamma^2 q^6}. \quad (15)$$

Отметим, что это выражение согласуется с полученным в работе [5] для коррелятора смещений мембраны.

Работа частично поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (93-02-2687), В.Г. благодарит фонд Сороса за финансовую поддержку.

-
1. S.A.Safran and N.A.Clark, *Physics of Complex and Supermolecular Fluids* (John Wiley and Sons, New York), 1987.
 2. Б.А.Дубровин, С.П.Новиков, А.Т.Фоменко, *Современная геометрия*, М.: Наука, 1979.
 3. Zinn-Justin, *Nucl. Phys. B* **275**, 135 (1986).
 4. W.Helfrich, *Z.Naturforsch* **103**, 67 (1975).
 5. E.I.Kais and V.V.Lebedev, *Europhys. Lett.* **22**, 469 (1993).
 6. N.Sourlas, *Physica D* **15**, 115 (1985).